① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-172537

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)6月19日

G 06 F 11/22

360 E 360 D 9072-5B 9072-5B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

**9発明の名称** 情報処理装置障害解析方式

②特 顧 平2-299716

②出 願 平2(1990)11月7日

@ 発明者 津布久 陽一

神奈川県秦野市堀山下1番地 株式会社日立製作所神奈川 工場内

**@発明者 西根 裕久** 

神奈川県秦野市堀山下 1 番地 株式会社日立製作所神奈川 工場内

**@発明者志賀 博** 

神奈川県横浜市戸塚区品農町504番2号 日立電子サービ

ス株式会社内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

加出 願 人 日立電子サービス株式

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地神奈川県横浜市戸塚区品濃町504番2号

会社 、 弁理士 小川 勝男

外1名

個代 理 人 最終頁に続く

昭 納 奪

1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

情報処理装置障害解析方式

前記障害情報に基づいて認識された先頭点灯障害検出回路に関する障害時のパス選択情報が存在する場合には、全ての該パス選択情報に従って障害時のデータ転送パスを特定して回路トレースを実施することにより、実際の動作とは

無関係な論理を排除した先頭点灯障客検出回路 のカバー領域を抽出する手段と、

前記障害情報に基づいて認識された先頭点灯障害検出回路が、同時に障害検出したため複数個存在する場合には、各先頭点灯障害検出回路のカバー領域の共通領域を抽出して、該共通領域を各先頭点灯障害検出回路を点灯させる原因となった障害の存在する最も疑わしい部分として指摘する手段と、

を有することを特徴とした情報処理装置障害 解析方式。

#### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、情報処理装置の稼動中に発生する障害を解析して故障部品を指摘する障害解析方式に関し、特に障害検出回路のカバー領域を限定すること、すなわち故障部品の指摘分解能および指摘精度向上に好適な障害解析方式に関する。

#### 〔従来の技術〕

論理設計情報から障害検出回路に対応した障害の発生が予想される交換部品を抽出することにより、故障辞書作成の自動化を目的としたものである。 これにより、作成工数の低減だけでなく、人手作業のミスに伴う指摘漏れや誤指摘を防止し、辞書の品質向上を可能とする。

また、特開昭 6 3 - 1 0 2 4 4 号公報には、論理シミュレーションを利用して故障伝播不能領域を除去することにより、故障静書の分解能を向上させるための故障辞書作成方法が記載されており、故障辞書の指に優先順位を付加することにより、故障辞書の指に優先順位を付加することにより、故障辞書の指載されている。これらはいずれも、故障辞書の精度向上を目的としており、保守効率の向上を可能とする。

### (発明が解決しようとする課題)

上記従来技術は、計算機能動以前にあらかじめ 論理設計情報を用いて故障辞 を作成するもので あるため、障害時に実際に動作した論理部分に故 保守交換単位を指摘する。この故障交換単位を交換することによって障害修復処理が行なわれる。

ところで、上記故障辞書には各際客検出回路ととろで、上記故障辞書には各際客検出回路とはりまる別で、その障害検出回路を点灯させるる対なった故障を含む保守交換単位を相構度はコントをである。との情報を表し、対策を発生したがって、障害を表している。との原因の関を容易としまかが存在をである。

しかしながら、この故障辞書の作成には特殊な 設計知識が必要であり、熟練した専門家による人 手作業に依存する度合いが強く、今後の部品の高 集積化に伴う計算機の論理規模の飛躍的な拡大に 対して、辞書の作成工数の急増及び辞書の品質の 低下が懸念されていた。

特開昭63-8836号広報に記載されている 故障診断許書作成方式は、このような背景から、

障箇所を限定することができず、故障部品の指摘 精度が不十分であることが問題であった。

また、近年、素子の高集積化、実装の高速度を構などのハードウェア技術の進步により、装置を構成する保守交換単位が大規模化するとともによる。上記従来技術による機関を取りである。上記従来技術によりで作成される故障許され、情報処理を取り段階では、大きのような環境に対する配慮がなく、保守交換単位上に搭載されている故障部局をは、保守交換単位上に搭載されている故障部局をよりの指摘分解能が不十分であるという問題があった。

さらに、コンカレントエラーチェック診断方式 を用いて保守現場で交換された保守交換単位から、 障害の原因となった故障部品を絞り込む場合、ハ ードウェアテスタや診断プログラムによる障害再 現テストの実施結果をもとに、原因の突明がなさ れる。ところがこの再現テストでは、障害が再現 するまでに長い時間を要する 合が多く、再現し ない場合にはそのまま高価な故障交換単位を廃棄 してしまうことが少なくない。このことは間歇障 客に対して無力であることを意味しており、工場 においても障害の種類に依存しない解析方式が切 望されている。

加えて、熟練した専門家の不足が修復効率の低 下を招いている。

本発明の目的は、専門家の知識に基づいて組織的な標準処理を実施することにより、高度な技術知識を必ずしも前提とせずに障害発生時の故障部品の指摘分解能および指摘精度を向上させる障害解析方式を提供することにある。

### (課題を解決するための手段)

ことにより、前記限定されたカバー領域に含まれる装置構成部品群を故障部品として指摘するようにしたものである。

#### (作用)

#### (実施例)

以下、本発明の動作原理と一実施例を図を用いて説明する。

実施することにより、実際の動作とは無関係な論 墨を排除した先頭点灯障害検出回路のカバー領域 (障害検出可能領域)を抽出する手段と、前記障 害情報に基づいて認識された先頭点灯障害検出回 路に関する全てのレジスタに対してパリティチェ ックを実施し、該先頭点灯障害検出回路を点灯さ せる原因となった障害データ、すなわちパリティ エラー情報が残存するエラーレジスタが存在する 場合には、レジスタ間接統情報をもとに最初に該 障害データをセットしたエラーレジスタを特定し て、該エラーレジスタを起点として回路トレース を実施することにより、先頭点灯障害検出回路の カバー領域を絞り込んで抽出する手段と、前記障 客情報に基づいて認識された先頭点灯障害検出回 路が、同時に障害検出したため複数個存在する場 合には、各先頭点灯障客検出回路のカバー領域の 共通領域を抽出して、該共通領域を各先頭点灯障 害検出回路を点灯させる原因となった障害の存在 する最も疑わしい部分として指摘する手段とを有 し、装置構成部品情報を含む故障辞書を参照する

まず、本発明の動作原理を説明する。

障害検出回路が、点灯時にその原因となる故障を含む領域を、障害検出回路のカバー領域(障害検出可能領域)と呼ぶ。コンカレントエラーチェック診断方式において利用される故障辞書の基本情報は、このような障害検出回路とそのカバー領域内に含まれる部品との対応情報である。

本発明では、障害時に収集された障害情報に含まれる点灯している障害検出回路に関するパス選択情報、障害データを保持しているレジスタ情報

をもとに、トレースの開始点、停止点を明確に設定した後、カバー領域抽出トレースを実施することにより、障害の原因となった故障を含む可能性が最も疑わしい領域を極力絞り込むことが可能となる。

アの機能として装置に組み込まれた識別用カウン 夕回路などを用いて容易に実現されている。この とき、障害情報10に含まれるセレクタ信号のセ ットノリセット状態を示す情報と、故障辞書20 に含まれる障害検出回路とセレクタ信号との対応 情報とから、先頭点灯障害検出回路に対応したセ レクタが存在するか否かを確認し、存在する場合 には、障害検出時に凍結されたパス選択情報を求 める(120)。次にステップ130において、 パス選択情報を解析して障害時のデータ転送パス を特定する。パス選択情報が凍結されている保証 がない場合、トレーサ信号をもとに障害時の動作 状態を分析し、選択情報の補正を行うことも可能 である。データ転送パスが特定したならば、従来 のカバー領域認識方法と同様に、先頭点灯障害検 出回路を開始点としてパツクトレースし、他の 障害検出回路のパリティ・チェック対象レジスタ などの停止点までをカバー領域として抽出する (140)。このとき、トレース中にセレクタに 到達した 合には、特定されたデータ転送パスを である。故障部品指摘リスト30は、先頭点灯障害検出回路名と被疑故障部品名及びその実装位置情報を含み、ディスプレイを関上に表示でも良いし、プリンタによって印刷出れるな管害解析方式1は、バス選択情報による障害解析部200と共通カバー領域情報による障害解析部300とで構成される。上記3つの解析部300とで構成されても良いし、組み合わされて事施されても良い。

以下に、各解析部の詳細を説明する。

第2回は、パス選択情報による障害解析部 100の処理手順を示すフローチャートである。 ステップ110において、障害情報10に含まれる障害検出回路の検出状態を示す情報から、最初に障害を検出したために点灯した障害検出回路を認識し、先頭点灯障害検出回路の認識は、従来から障害検出回路相互の従属関係情報、あるいはハードウェ

除いて、トレースを停止しているため、従来方法 よりカバー領域が絞り込まれる。カバー領域の抽 出が終了した時点で、領域内の装置構成部品を放 障部品として指摘する(150)。

第3図は、エラーレジスタ情報による障害解析 部200の処理手順を示すフローチャートである。 ステツプ210において、障害情報10をもとに 先頭点灯障害検出回路を認識し、障害情報10に 含まれる凍結時のレジスタの内容を示す情報と、 故障辞書20に含まれる障害検出回路のカバー領 域内レジスタ間接統情報とから、先頭点灯障客検 出回路に関する全レジスタのパリティチェックを 実施する(220)。先頭点灯障害検出回路を点 灯させる原因となったパリティエラー情報(障害 データ)が残っているエラーレジスタが存在する 場合には(230)、レジスタ間接統情報をもと に、そのエラーレジスタの中から最初に障害デー タをセットしたエラーレジスタを特定し、それを カバー領域抽出の開始点とする(240)。 先頭 点灯障害検出回路のカバー領域抽出は、この開始

点からバックトレースが実施される(250)。 このとき、この最初のエラーレジスタと先頭点灯 障害検出回路の間をカバー領域外として排除する ことができる。カバー領域の抽出が終了した時点 で、領域内の装置構成部品を故障部品として指摘 する(260)。

第4回は、共通カバー領域情報による障害解析 部300の処理手順を示すフローチャーのを たのの処理手順を示すフローチャーのを を を のの処理手順を のの処理手順を を を のの処理手順を ののの処理手順を ののの処理手順を ののの処理手順を ののののののので を ののののので を と のので を と のので を と のので を と のので を を と のので を を と のので ののののので ののので のので を のので と のので のので を のので と のので の

した場合に、パス選択情報による障害解析100 を実施した結果、カバー領域561が抽出された ことを示す。指摘故障部品は、LSI1(550), LSI3 (552), LSI4 (553) である. 第5図(c)は、レジスタ521が最初に障害デー タをセットした場合に、エラーレジスタ情報によ る障害解析200を実施した結果、カバー領域 562が抽出されたことを示す。ここで注意しな ければならないことは、障害検出回路510に関 速するレジスタは520~525であるが、レジ スタ520は障害検出回路510のパリティ・チ ェック対象レジスタであるため、それ以外のレジ スタから最初に障害データをセットしたレジスタ を探索することである。これは、レジスタ間の論 理的接続関係などにより容易に実現する。ここで 指摘故障部品は、LSI2 (551), LSI3 (552) である。

第6図において、障客検出回路610 (CHK 1),620 (CHK2) は、ともに先頭点灯隙 客検出回路である。共通カバー領域情報による障 一領域の抽出は、上記パス選択情報による障害解析部100、エラーレジスタ情報による障害解析部200の処理手続きに従ったものでも良いし、従来方法によるものでも良い。求められたカバー領域の共通領域内に含まれる装置構成部品を故障部品として指摘する(350)。

本実施例による効果を第5図、第6図を用いて 説明する。第5図において、510~513は障 客検出回路、520~528はレンタをであり、 を対したとりを信号(XXSELA)であり、 とび、ないないであり、 はでいる場合、541を選択する。531 はないもとで、様である。この(ACK来のは、 は成のもとで、検出回路510(ACK来のは、 による先頭点灯を書る。第5回のか、 による先頭点灯を書る。第5回のか、 による先頭点灯を書る。第5回のか、 による先頭点灯を書る。第5回のか、 による先頭点灯を書る。第5回のか、 による先頭点灯を書る。第5回のか、 による先頭点灯を書る。第5回のか、 による先頭点灯を書る。第5回のか、 によるを示し、その指摘を節部は、このは、 によるを示し、その指摘を節部は、このは、 によるを示し、この指摘を節節による。第5回(b) は、セレクタ信号530が論理値で1でにないて

客解析 3 0 0 を実施した結果、斜線で示す共通領域が抽出されたことを示す。この共通領域により、故障交換単位 6 3 0 (FRU1)が唯一つ指摘されるだけでなく、交換単位 6 3 0 上に搭載されている部品も指摘される。

上記いずれの障害解析によっても、従来方法に 比べてカバー領域が限定されて抽出されるため、 故障部品指摘の分解能と精度の向上が可能となる。 さらには、処理を標準化したことにより、効率の 良い保守、修理が可能となる。

本発明は、以上の実施例に限定されるものでないことは明らかである。

#### 〔発明の効果〕

本発明によれば、障害時に凍結された障害情報に基づいて障害検出回路のカバー領域を絞り込むため、実祭に動作した論理部分に故障箇所を限定することが可能であり、故障部品の指摘分解能と指摘精度の向上に効果がある。

また、障害情報に基づいているため、固定障害 や間歇障害といった障害の種類の区別なく解析を

## 特開平4-172537(6)

実施することが可能であり、保守現場においては 保守交換単位での故障の指摘を、情報処理装置の 生産工場においては再現テストの必要がなくなり、 故障保守交換単位上の故障部品を指摘できるので、 障害回復処理の作業時間が短縮するという効果が ある。加えて、処理の標準化により、高度な専門 知識を前提としない保守、修理が可能である。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例である情報処理装置 障害解析方式の構成概略図、第2図は第1図に含 まれるパス選択情報による障害解析部の処理手順 を示す図、第3図は第1図に含まれるエラーレジ スタ情報による障害解析部の処理手順を示す図、 第4図は第1図に含まれる共通カバー領域情報に よる障害解析部の処理手順を示す図、第5図(a) (b)(c)はモデル回路を用いた障害検出回路に パー領域の概念図、第6図は共通カバー領域の概 念図である。

1…情報処理装置障害解析方式

10…障害情報

20…故障辞書

30…故障部品指摘リスト

100~150…パス選択情報による障害解析処理

200~260…エラーレジスタ情報による障害解析処

.

300~350…共通カバー領域情報による障害解析処

珥

510~513…陳客検出回路

520~528…レジスタ

530~531…セレクタ信号

540~543…データ転送パスルート

\$50~553…装置構成部品 (LSI)

560~562…カバー領域

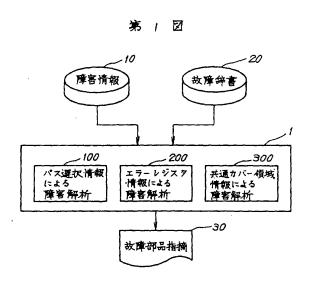
610~620…障害検出回路

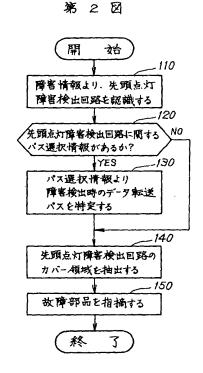
611~621…カバー領域

630~630…保守交換可能単位

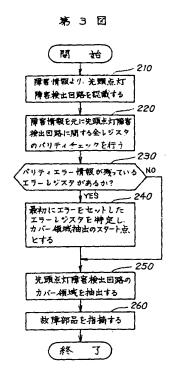
代理人弁理士 小 川 勝 男

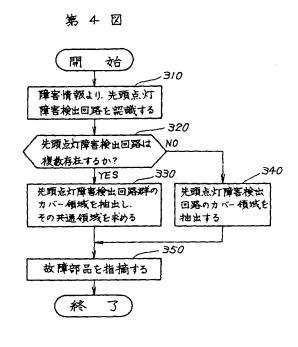


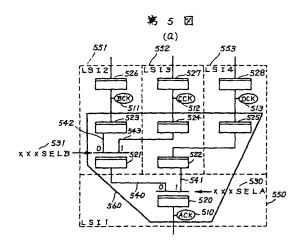


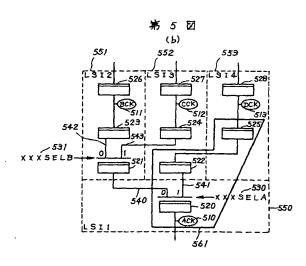


### 特開平4-172537(ア)

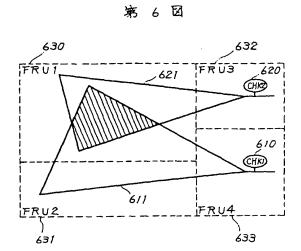








(C)
(557)
(552)
(553)
(S12)
(553)
(S12)
(S13)
(S27)
(S14)
(S15)
(S



第1頁の続き ②発 明 者 金 子 守 神奈川県横浜市戸塚区品濃町504番2号 日立電子サービ ス株式会社内